## 数理的手法による電子顕微鏡像の解析と構造予測

東北大学原子分子材料科学高等研究機構 井上和俊 陳 春林 小谷元子 東京大学大学院工学系研究科総合研究機構 斎藤光浩 幾原雄一



金属やセラミックス材料は一般に多結晶体であり, 粒界構造と機能物性には深い関係がある. 傾角粒界は しばしば構造ユニットと呼ばれる多面体の配列で構成 され,粒界転位の導入により不整合が局在化する. 粒 界転位は相互作用を極小化するため平均的に配列する ことから,構造ユニット列は準周期の一部を実現する. **Fig. 1**は傾角35.2°をもつ MgO<001>対称傾角粒界の 高角環状暗視野像(JEM-ARM200F, 200 kV)である が, $\Sigma$ 5(310)ユニットが大部分を占める中,粒界転位 として $\Sigma$ 17(410)ユニット(Fig. 1 矢印部)が導入され る.

一方,既約分数からなるファレイ数列は,分母同
土・分子同士を加算する演算(a/b田c/d=(a+c)/(b+d))により各世代が結ばれ,二分木をなす(Fig.
2).分数 p/q を(q p 0)粒界面に対応させると,ファ

レイ数列における分数の構成から粒界構造ユニットの 配列を任意の精度で予測することができる.例えば Fig. 1 の粒界面は(41 13 0)面と近似でき,Fig. 2 の 下方に存在する13/41は,A=(310),B=(410)ユニ ットに対応する  $1/3 \ge 1/4$  の和で構成されている. 二分木を下から上へ遡る手法により,5 個と6 個の (310)ユニット列の間に(410)ユニットが1つずつ挿 入されることが予測される(AAAAB.AAAAAB). 原子分解能走査透過電子顕微鏡によって予測通りの構 造が観察された<sup>(1)</sup>.

## 文 献

 (1) K. Inoue, M. Saito, C. Chen, M. Kotani and Y. Ikuhara: Microscopy, (2016), doi:10.1093/jmicro/dfw034.
 (2016年7月25日受理)[doi:10.2320/materia.55.582]

Mathematical Analysis of Tilt Boundaries and STEM Observations; Kazutoshi Inoue\*, Mitsuhiro Saito\*\*, Chunlin Chen\*, Motoko Kotani\* and Yuichi Ikuhara\*,\*\* (\*Advanced Institute for Materials Research, Tohoku University, Sendai. \*\*Institute of Engineering Innovation, The University of Tokyo, Tokyo)

Keywords: *STEM* (scanning transmission electron microscopy), HAADF (high-angle annular dark field), grain boundary, structural unit TEM specimen preparation: ion milling (PIPS691, Gatan, Ltd.) TEM utilized: JEM-ARM200F (200 kV, JEOL Ltd.)